## 单次曝光显微剪切全息干涉仪

陈守华徐毓光

(中国科学院上海光机所)

提要:本文所介绍的干涉仪具有全息记录光路简单、自动保证基本等光程、所记录的波前可以在不同的参考背景中复现等项特点,适用于有很高时空分辨要求的干涉测量。

## Single-exposure holographic shearing microinterferometer

Chen Shouhua Xu Yuguang

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

**Abstract**: The interferometer introduced in this paper has such properties as simple optical arrangment for holographic recording, automatic insurence of the optical path quality and reproducibility of recoded wavefronts in different reference background. It can be applied to interferometry with high temporal and spatial resolution requirements.

三平板剪切干涉仪具有稳定、等光程、调整方便等优点。在三平板剪切干涉仪上附加 显微光路,并使波面结构以全息方式记录,便 得到显微剪切全息干涉仪,它兼有三平板剪 切干涉和全息干涉的优点。

显微剪切全息干涉仪的结构光路如图1 所示。以单模 He-Ne 激光束聚焦照明待测物 T,经显微物镜 M 放大后成象于 H 平面。全 反射镜 A、B 和半反平板 C 组成三平板剪切 干涉。 C 板将入射光束分成二路,分别依顺 时针及逆时针方向在 A、B、C 回路中循环一 圈后到达 H 平面。不论三平板相对位置如何 变动,出射后的二路光束的波场只有一个横



向平移。平移量(包括大小及方向)可以连续 调整。设待测物 T 尺寸有限,其在 H 平面上 的象限于半径为 R 的圆区域内,在 H 平面上 的波场分布与图 2 所示等效。与 H 平面相 距 l 的二个点源  $S_1$ 、 $S_2$  分别与二路光束对 应,它们之间有横向平移  $d = (dx, dy), \Omega_1$ 和  $\Omega_2$  分别是二路光束的成象区域。在 H 平面



上建立  $x_1 - y_1$  坐标,取  $\Omega_1$  中心为坐标原点, 把平移量调到足够大,使  $|d| > 2R_o$  于是, *H* 平面上的总波场是:

收稿日期: 1979年9月28日。

$$\left(E_{s}(x_{1}, y_{1})t(x_{1}, y_{1})e^{i\phi(x_{1}, y_{1})}+E_{s}(x_{1}-dx_{1}, y_{1}-dy_{1})(\Omega_{1})\right)$$
(1.1)

$$E(x_1, y_1) = \begin{cases} E_s(x_1 - dx_1, y_1 - dy_1)t(x_1 - dx_1, y_1 - dy_1)e^{i\phi(x_1 - dx_1, y_1 - dy_1)} + E_s(x_1, y_1)(\Omega_2) & (1.2) \end{cases}$$

$$\left( E_{s}(x_{1}, y_{1}) + E_{s}(x_{1} - dx_{1}, y_{1} - dy_{1}) \right) (\ddagger \& [x_{1}, y_{1}]$$
(1.3)

式中  $E_s(x_1, y_1) = E_0 \exp\left[\frac{i\pi}{\lambda l}(x_1^2 + y_1^2)\right]$ 是发 自点源  $S_1$ 的球面波场;  $t(x_1, y_1)e^{i\phi(x_1, y_1)}$ 是经 显微物镜 *M* 放大后的 *T* 的透过函数。

(1.3)式是二球面波在 H 平面上剪切相 干,它形成与平移**d** 垂直的直条纹,条纹频率  $\nu \approx \frac{|d|}{l\lambda}$ ,这就是全息记录的载频。 举一个实 用的例子,取 |d| = 2R = 40 毫米,  $l = 2 \times 10^3$ 毫米,  $\lambda = 0.6 \times 10^{-3}$  毫米,则  $\nu = 32$  毫米,载 频很低,可以用普通胶卷记录。

(1.1)式和(1.2)式表明, T的透过函数  $t(x_1, y_1)e^{i\phi(x_1, y_1)}$ 以两种不同的方式分别记录 在 $\Omega_1$ 和 $\Omega_2$ 区域内。在H平面放上胶卷,曝 光一次,就得到一张单次曝光全息图。

为简单起见,以下只讨论  $\Omega_1$  内全息图的 复现,  $\Omega_2$  的讨论完全一样。

用单次曝光全息图准确复现波前的主要 困难在于胶片厚度不均匀所带进的位相畸 变。单次曝光后胶片上的光强 *I*(*x*<sub>1</sub>, *y*<sub>1</sub>)可 写为:

 $I(x_1, y_1) = |E_s(x_1, y_1)t(x_1, y_1)e^{i\phi(x_1, y_1)} + E_s(x_1 - dx_1, y_1 - dy_1)|^2 (2)$ 

假定乳胶工作在特性曲线的线性区域, 并用 e<sup>it(a1, y1)</sup> 表示因胶片厚度不均匀而引进 的位相畸变。于是,得到胶片的透过函数是:

 $T = \beta' e^{i_{f}(x_{1}, y_{1})} I(x_{1}, y_{1})$ (3)

其中,β'是常数。

用相距 l' 的点光源 S' 照明全息底片, 透射波面是:

$$\begin{split} \boldsymbol{\varepsilon} &= E_{S'}(\boldsymbol{x}_1, \ \boldsymbol{y}_1) \ \boldsymbol{T}(\boldsymbol{x}_1, \ \boldsymbol{y}_1) \\ &= \boldsymbol{\varepsilon}_1 + \boldsymbol{\varepsilon}_2 + \boldsymbol{\varepsilon}_3 + \boldsymbol{\varepsilon}_4 \end{split}$$

其中

$$\varepsilon_{1} = \beta' E_{0}^{2} E_{S'}(x_{1}, y_{1}) e^{if(x_{1}, y_{1})} \quad (4.1)$$
  

$$\varepsilon_{2} = \beta' E_{0}^{2} t^{2}(x_{1}, y_{1}) E_{S'}(x_{1}, y_{1}) e^{if(x_{1}, y_{1})} \quad (4.2)$$

 $s_{3} = \beta' E_{s}(x_{1}, y_{1}) E_{s}^{*}(x_{1} - dx_{1}, y_{1} - dy_{1})$   $\times E_{s'}(x_{1}, y_{1}) t(x_{1}, y_{1}) e^{i\phi(x_{1}, y_{1})} e^{if(x_{1}, y_{1})}$  (4.3)

$$\varepsilon_{4} = \beta' E_{s}^{*}(x_{1}, y_{1}) E_{s}(x_{1} - dx_{1}, y_{1} - dy_{1}) \\ \times E_{s'}(x_{1}, y_{1}) t(x_{1}, y_{1}) e^{-i\phi(x_{1}, y_{1})} e^{if(x_{1}, y_{1})}$$

$$(4.4)$$

而  $E_{g'}(x_1, y_1) = E_0 \exp\left[\frac{i\pi}{\lambda l'}(x_1^2 + y_1^2)\right]$  是发 自 S' 的球面波场。

显然,因为  $|s_3|^2 = |s_4|^2 = Bt^2(x_1, y_1)$ (B 是常数),所以,它们给出T的影象。另外 (4.3)式和(4.4)式中所载有的信息除了  $t(x_1, y_1)e^{i\phi(x_1, y_2)}之外,尚有由胶片厚度起伏$  $带进的相位畸变项 <math>e^{it(x_1, y_2)}, e^{it(x_1, y_2)}$ 的影响必 须消除。

我们先来研究图 3 的光路。将一焦距为 f 的凸透镜放在三平板机构的输出端,因为 无穷远的物点发出的光线可视为一束平行 光,经三平板干涉仪横向平移后,在透镜 F 的焦点处仍只成一点象,并不产生横向剪切。 所以,用图 4 所示的机构复现单次曝光全息 图可以完全消除 e<sup>if (21,15</sup>)</sub> 的影响。

图中, *S* 是复现点光源, *H* 是单次曝光 全息图,透镜 *F*<sub>1</sub> 将 *H* 成象于无穷远处, *S* 的



(·和 × 表示二组不同的衍射象)



图 7

衍射象在 S' 平面。A. B. C 是三平板剪切机 构,它使在 S' 平面上有二组衍射象。若使某 组零级衍射象与另一组的一级衍射象相重, 则在透镜  $F_2$  的焦平面 H' 处  $[(x_2-y_2)]$  平面 的强度是.

$$I(x_2, y_2) = \beta^2 |1 + t^2(x_2, y_2) + t(x_2, y_2)e^{i\phi(x_2, y_2)}|^2$$
(5)

可见 e<sup>if(x1, y2)</sup> 的影响已完全消去, 所得到的干 涉条纹完全由 T 的透过函数的 位相部分 确 定。另外,若使某组的+1级衍射象与另一 组的-1级衍射象相重,干涉灵敏度可提高 一倍,此时:

$$I(x_2, y_2) = \beta^2 t^2(x_2, y_2) \left| 1 + e^{2i\phi(x_2, y_2)} \right|_{\circ}^2$$
(6)

通过微调三平板位置,在不同的参考条 纹背景中观察T的波面,由此可以判断弧岛 型条纹的干涉级数及详察波面的细结构。

我们用上述方法拍摄了玻壳微球单次曝 光全息图。玻壳球的直径约60微米,壳厚约 0.5 微米, 显微放大约 400 倍。 图 5 是该玻 壳球的单次曝光全息图。图6(a)是以零级 和1级衍射象相重所得到的干涉图;图6(b) 是当零级和1级衍射象稍有错开时的干涉 图, 它相当于加背景条纹后的干涉图样。单 次曝光全息图复现的优越性在这里可以看得 很清楚,不仅可以判断环形条纹的级数,而且 可以看到局部(如玻壳处)波面的突变。图 7(a) 是+1级和-1级相重合的干涉环图, 图7(b)是变换背景后的干涉图样。

. 按前面的分析, 为了消除胶片厚度不均 匀对波面畸变的影响,必须将图4中的日调 在 $F_1$ 的前焦面处,否则物体T的位相函数 e<sup>i \$(x1, y1)</sup> 几乎完全湮没于波面畸变 6<sup>if(x, y)</sup>之 中,正如图8所示。